

Author Index

B

Benson, C. H., 113
 Bezat, F. A., 276
 Blümel, M., 276
 Borden, R. H., 170
 Bosscher, P. J., 113

C

Chaney, R. C., 43
 Cheng, D.-S., 156
 Coop, M. R., 231
 Cuccovillo, T., 231

D

DeGroot, D. J., 203
 Dudley, J. W., II, 14

E

Edwards, B. D., 83

F

Fairhurst, C. E., 290

G

Glaser, S. D., 14

H

Hankour, R., 300
 Harig, M. D., 43
 Hayano, K., 259

K

Kalinski, M. E., 137, 156
 Kayen, R. E., 83

L

LaPlante, C., 95
 Lee, H. J., 83
 Lehman, M. A., 3, 69

M

Marr, W. A., 193, 300
 Mellegard, K. D., 247
 Mitchell, T. J., 203
 Moo-Young, H. K., 29, 95
 Morii, T., 57

N

Nakagawa, K., 57

O

Ochola, C. E., 29
 Ott, N. L., 69

P

Pfeifle, T. W., 247
 Potyondy, D. O., 290

R

Roesset, J. M., 137, 156

S

Shao, L., 170
 Sheahan, T. C., 203
 Shlyapobersky, J., 14
 Stokoe, K. H., II, 137, 156

320 NONDESTRUCTIVE AND AUTOMATED TESTING METHODS

T

Tatsuoka, F., 259
Torosian, G. T., 300

V

Van Dam, T. J., 3
Viton, S. J., 3, 69

Y

Yoshiizumi, N., 259
Young, Y. L., 137